

National Instruments veröffentlicht Automated Test Outlook 2012

12.07.2012, 18:54 | IT, New Media & Software

Pressemitteilung von: *National Instruments Germany GmbH*

Highlights

- Der Bericht gibt einen Überblick über aktuelle Geschäftsstrategien, Systemarchitekturen, Datenverarbeitung, Software und I/O, die sich auf die Elektronikindustrie von heute und von morgen auswirken.
- Dank jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich der automatisierten Testanwendungen profitiert National Instruments von langjährigen Geschäftsbeziehungen, internem Fachwissen und der Forschungsarbeit von Drittanbietern. So erhalten Anwender stets aktuelle und umfangreiche Einblicke in die Branche.
- Zu den Highlights des Technologieausblicks zählen die Art und Weise, wie mobile Geräte die Branche beeinflussen, sowie Empfehlungen dazu, wie Unternehmen strategische Wettbewerbsvorteile durch Optimierung der Prüfabteilungen erlangen können.

Pressemitteilung, 13. Februar 2012 – National Instruments (Nasdaq: NATI) veröffentlicht den Automated Test Outlook 2012, in dem das Unternehmen Forschungsergebnisse zu aktuellen Mess- und Prüftechnologien sowie -methoden vorstellt. Der Technologieausblick geht auf die Trends ein, die sich auf zahlreiche Branchen und Bereiche auswirken, darunter Unterhaltungselektronik, Automobilindustrie, Halbleiterindustrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigungswesen, medizinische Geräte und Nachrichtentechnik. Mit diesen Kenntnissen können Ingenieure und Abteilungsleiter von den neuesten Strategien und besten Vorgehensweisen für die Optimierung einer Prüfabteilung profitieren.

Der Technologieausblick ist in fünf Kategorien eingeteilt – Geschäftsstrategien, Systemarchitekturen, Datenverarbeitung, Software und I/O – und beschäftigt sich mit folgenden Trends:

- Optimierung von Prüfabteilungen: Unternehmen machen den Prüfbereich zu einem strategisch wichtigen Unternehmensbestandteil, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu sichern.
- Messung und Simulation im Designprozess: Die Kombination anspruchsvoller Modelle mit realen Messungen verbessert die Produktqualität und verringert die Entwicklungszeit.
- Externe PCI-Express-Schnittstellen: Der in einem PC integrierte Hochgeschwindigkeitsbus mit geringer Latenz ermöglicht aufgrund von externen Schnittstellenverbesserungen neue Systemtopologien.
- Vormarsch mobiler Endgeräte: Smartphones und Tablet-PCs sind weit verbreitet und verändern die Art und Weise, wie Prüfsysteme überwacht, gesteuert und geregelt werden können.
- Portierbare Messalgorithmen: Mithilfe neuer Entwicklungswerkzeuge müssen Messalgorithmen (IP) nur einmal erstellt werden und können dann für eine Vielzahl verschiedener Zielsysteme genutzt werden.

Der Automated Test Outlook 2012 basiert zum einen auf Lösungsansätzen aus den Bereichen Industrie, Wirtschaft, Forschung und Lehre, zum anderen auf Angaben aus Anwenderforen und Umfragen. Auf Grundlage dieser Daten gibt der Technologieausblick eine umfassende Übersicht über die neuen Trends, mit denen die geschäftlichen und technologischen Herausforderungen im Mess- und Prüfbereich bewältigt werden können.

Der Automated Test Outlook 2012 kann unter www.ni.com/ato/d heruntergeladen werden.

Portrait

Über National Instruments

Seit 1976 stellt National Instruments (www.ni.com) Ingenieuren und Wissenschaftlern Werkzeuge zur Verfügung, mit denen sie produktiver, innovativer und kreativer arbeiten können. Das Konzept des Graphical System Design gibt Anwendern eine Plattform mit integrierter Hard- und Software für die schnelle Entwicklung von Mess-, Steuer- und Regelsystemen an die Hand. Das langfristige Ziel des Unternehmens ist, mit seinen Technologien einen Beitrag dazu zu leisten, unseren Alltag zu verbessern, unsere Gesellschaft zu unterstützen und den Herausforderungen der Menschheit als Ganzes zu begegnen. Dies gewährleistet den Erfolg von Kunden, Angestellten, Zulieferern und Aktionären.

News-ID: 647896 • Views: 733 (Stand: 21.05.2026)

Link zur Pressemitteilung:

<https://www.openpr.de/news/647896/National-Instruments-veroeffentlicht-Automated-Test-Outlook-2012.html>